

機種名 走査電子顕微鏡(SEM)
メーカー 日立ハイテク
型式 S-3700N
利用目的 金属、半導体、粉末、鉱物などの固体試料の観察や元素分析
(定性、線分析、面分析)、試料表面の形状測定
生体試料や非導電性試料の測定(低真空モード)
分析不可 水分やガスを含む試料、磁性材料
担当 山本/山口/長田
連絡先 info@kitcia.kyutech.ac.jp



概要

大型試料を搭載可能な走査電子顕微鏡。(センター保有試料台サイズは 100 mm 径)

* 100 mm 径以上の試料は要相談[300 mm 径まで搭載可能]

低真空モードで、絶縁物質や生体物質も SEM 観察が可能。液体窒素素の EDS を搭載しており、手軽に元素分析ができる。COMPO 像を使用した 3D 画像解析が行える。

仕様・性能

タングステン電子銃

加速電圧 0.3～30kV

二次電子像分解能 3.0nm(高加速電圧 30kV)

10nm(低加速電圧 3kV)

反射電子像分解能 4.0nm(低真空モード)

倍率 ×5～300,000

最大搭載可能試料サイズ 300 mm 【要相談】*センター保有試料台 100 mm まで

最大観察可能範囲 203 mm 径(R 併用)

利用方法

- ・代理操作(測定条件の検討や解析は依頼者が行う)
- ・自己操作(装置操作講習受講後 測定可)
- ・粉末試料、低真空モード測定は原則技術員及びスタッフが行う。

講習

講習については [info\(at\)kitcia.kyutech.ac.jp](mailto:info(at)kitcia.kyutech.ac.jp) まで